

資料

平成18年度大学入試センター試験英語リスニングテストにおける 不具合等の申し出があった機器の検証結果等について

大学入試センター

1. はじめに
大学入試センターでは、平成18年1月に行った大学入試センター試験の英語リスニングテストにおいて不具合等の申し出のあった機器を回収し、申し出のあった状態が再現するかどうか、その原因は何かなどについて、様々な観点から調査分析を行った。

ここでは、この結果とこれに基づいた平成19年度大学入試センター試験で使用する機器の主な変更点について述べる。

2. 不具合等の申し出のあった機器の検証結果

検証の対象としたのは、「解答中に不具合等の申し出があったもの」444台及び「解答開始前の作動確認中に不具合等の申し出があり、交換したもの」1,023台。検証結果は以下のとおり。

(1) 解答中に不具合等の申し出があったもの

原因別の件数は、「イヤホン不良等」5台、「音声メモリーにゴミが付着」58台、「再生ボタン長押しの

失敗」111台、「イヤホン差込部の酸化被膜発生による接触不良」258台等となっている。

(2) 解答開始前の作動確認中に不具合等の申し出があり、機器を交換したもの

原因別の件数は、「イヤホン不良等」51台、「音声メモリーにゴミが付着」599台、「イヤホン差込部の酸化被膜発生による接触不良」322台等となっている。

3. 主な変更点

以上の検証結果を踏まえて、次のような変更を行うこととした。

(1) 再生ボタンの長押しの失敗を防止するため、「3 再生ボタン」のほか、「1 電源ボタン」と「2 確認ボタン」についても長押しとする。この結果、受験者が操作するボタンは3つとも長押しとなり、操作が統一される。

また、電源ランプや作動ランプが光るまでボタンを押し続けるよう、機器本体に注意事項を印刷す

る。

- (2) 機器背面の電池ケースに差し込んだりある絶縁シートを抜き取る際に指が滑らないよう、絶縁シートの中央部分をくり抜く。
- (3) 音声メモリーにゴミが付着することを防止するため、一つ一つ袋に入れた状態で受験者に配付する。
- (4) イヤホンについては、あらかじめ

ICプレーヤー本体にプラグが差し込まれた状態で配付する。

以上が主な変更点であり、リスニングテストの詳細は受験案内に掲載している。また、大学入試センターのホームページのICプレーヤー操作ガイドについては、3つのボタンを全て長押しした内容に更新してある。ぜひ操作を体験していただきたい。

〈平成18年度大学入試センター試験英語リスニングテストにおける不具合等の申し出があった機器の検証結果等について（抜粋）〉（平成18年4月28日公表）

I 解答中に不具合等の申し出があったもの

1 検証対象機器台数 444台

（参考）解答中に不具合等の申し出があった機器台数 471台

（注）上記471台のうち、机上からの落下や急な体調不良等による申し出があった27台は対象から除いた。

2 検証方法

不具合機器について、大学入試センター職員立会いのもと、メーカーが検証作業を実施。全体の約4割について大学入試センターも抜取り検査を実施。

3 検証結果

不具合の態様	機器の不具合の原因		台数
音声が出ない又は中断	A. 機器の製造工程に起因するもの	イヤホン不良	2
		スイッチ不良	1
		IC不良	2
	B. 機器の使用時の事情に起因するもの	小計	5
		音声メモリーにゴミが付着	58
		再生ボタン長押しの失敗	111
		小計	169
雑音が入る又は音声が不安定	C. イヤホンの素材に起因するもの	イヤホン差込部の酸化被膜発生による接触不良	258
△	D. その他	検証では不具合が再現できず、かつ、不具合の原因の形跡が確認できなかつたもの	12
	合計		444

II 解答開始前の作動確認中に不具合等の申し出があり、機器を交換したもの

検証対象機器台数 1,023台

不具合の態様	機器の不具合の原因	台数	
音声が出ない又は中断	A. 機器の製造工程に起因するもの	イヤホン不良	16
		IC不良	6
		基盤への部品取付け不良	1
	B. 機器の使用時の事情に起因するもの	絶縁シートが抜けない	28
		小計	51
雑音が入る又は音声が不安定	C. イヤホンの素材に起因するもの	音声メモリーにゴミが付着	599
		小計	
	D. その他	イヤホン差込部の酸化被膜発生による接触不良	322
△	D. その他	検証では不具合が再現できず、かつ、不具合の原因の形跡が確認できなかつたもの	51
		合計	1,023